文章编号:0253-2239(2002)08-0924-03

双面金属包覆介质波导的直接耦合方法*

李红根 沈启瞬 曹庄琪

(上海交通大学物理系,上海 200240)

沈玉全 翟剑峰

(中国科学院理化技术研究所,北京 100101)

摘要: 根据双面金属包覆介质波导的特殊性质,提出了一种新的波导耦合方法,这种技术在不用棱镜、光栅和其 它元件的情况下,可使光能从金属表面直接耦合进波导。实验结果与理论预言符合得很好。 关键词: 直接耦合;光波导;色散特征

中图分类号:TN25 文献标识码:A

1 引 言

自导波光学问世以来,由于它在未来信息社会 巨大的应用潜力,一直受到学术界和技术界的高度 重视。经过 30 多年的发展,今天已初步成为一门体 系完整的学科。

导波光学器件的基本元件是光波导,与波导同 时诞生和发展的是它的耦合技术。目前常用的有棱 镜耦合^[1]、光栅耦合^[2]、端面耦合^[3]和劈形耦合^[4]等 方法。棱镜耦合虽不利于集成化,但利用该方法可 以测量波导的参数。因此这一方法至今仍在实验室 中普遍使用。光栅耦合利于集成,但复杂的制备技 术和低的耦合效率阻碍了这种方法的广泛使用。端 面耦合和劈形耦合也各有其优缺点和适用的波导。 另外由于双面金属包覆介质波导的特殊构造,近年 来已在电光波导调制器和电光系数的测量等领域获 得了广泛的应用^[5,6]。

与全介质波导和单面金属包覆介质波导不同, 双面金属包覆介质波导的有效折射率可在零与无穷 大之间变化,我们利用这个特点提出了将光束直接 射向波导表面,在入射光波矢与导模传播常数匹配 情况下,可实现光能与导模能量的耦合。在此基础 上,我们制备了金属-有机薄膜-衬底结构的双面金 属包覆介质波导,并利用角度扫描的方法得到了衰 减全反射曲线,实验结果证实了我们的预言。

* 国家自然科学基金(60047004)资助课题。
E-mail leehgen@yeah.net
收稿日期 2001-08-13;收到修改稿日期 2001-09-21

2 原 理

对于图 1 所示的全介质平板波导或单面金属包 覆介质波导 ,不失一般性 ,可设 $n_1 > n_2 > n_0$ (对金 属覆盖层 ,在可见光和近红外波段 , $n_0 < 1$),则该波 导有效折射率的取值范围是

$$n_2 < N < n_1$$
, (1)

式中 $N = \beta / k_0$, β 为导模传播常数, $k_0 = 2\pi / \lambda$ 为真 空中的波数, λ 为真空中的波长。光若从覆盖层直接 入射,则根据波矢匹配条件:

$$k_0 n_0 \sin \theta_0 = \beta , \qquad (2)$$

则要求 $\sin\theta_0 > 1$ 显然不可能。



Fig.1 Dielectric planar waveguide

为了能使光束耦合进波导,一个有效的办法是 在波导覆盖层上放置一高折射率棱镜,如图2所示, 当光从棱镜一斜面入射,在入射角大于棱镜和覆盖 层之间的临界角的情况下,覆盖层中为两相反迅衰



Fig.2 Prism-waveguide coupling configuration

场的叠加。若满足匹配条件

$$k_0 n_3 \sin \theta_3 = \beta , \qquad (3)$$

则入射光可以激发波导中的导模。

但对于图 3 所示的双面金属包覆介质波导,对 一般的贵金属来说(如金、银、铜、铝等),由于在可见 光和近红外波段的特殊性质,使得双面金属包覆介 质波导中传输模的色散性质如图 4 所示^[7]。







Fig.4 Dispersion characteristics of double metal-cladding waveguide

由图可见 除 TM₀ 模之外,其他所有模式的有 效折射率都可以趋近于零,即有

$$0 < N < \sqrt{\frac{n_1^2 n_2^2}{n_1^2 + n_2^2}}$$

当光从上层金属膜上的 n_3 介质入射时 ,就有可能 满足波矢匹配条件(3)式 ,使光束直接从金属表面耦 合进波导 ,而不会产生 $\sin\theta_3 > 1$ 的矛盾。

3 样品制备和实验测量

3.1 双面金属包覆介质波导的制备

首先把经过清洗的玻片置于溅射机中,根据时间控制溅射一层厚度约 200 nm 的金膜,由于当金膜的厚度超过 150 nm 时,可完全隔离衬底的影响,可把这层金膜看作无穷厚。然后用自旋涂覆法均匀地涂上一层聚酰亚胺(PI)有机薄膜,经过 DEKTAK

轮廓测厚仪测量 膜厚约为 2700 nm ,为防止金粒子 渗入有机膜,在小功率条件下,在有机膜表面溅射一 层薄的金膜作为耦合层。其厚度 *d* 和复介电系数 ε₂ ,可利用陪片经双波长法测得⁸¹ ,光波长为780 nm 时测得

$$d = 36 \text{ nm}$$
 ,

$$\varepsilon_2 = -20 + i1.5$$
.

所得介电系数结果与文献 9,10 始出的参量十 分接近。

双面金属包覆介质波导制作流程图如图 5 所 示。



Fig. 5 Fabrication process of double

metal-cladding waveguide

3.2 角度扫描法观测导膜的激发

实验装置如图 6 所示,光源为带准直器的半导 体激光光束(λ = 780 nm,发散角小于 1 mrad),通过 小孔滤除边缘光束,经过起偏器后变成偏振光,直接 射向样品表面,样品放在 $\theta/2\theta$ 仪上,样品每转动 θ 角,反射光线转动 2 θ 角,探测器放在 2 θ 转盘上,能 够保证探测器时刻跟踪反射光。样品的扫描通过步 进电机驱动,最小步长角度为 5 × 10⁻⁴ rad。计算机 控制步进电机的转动,探测器接收的信号放大后经 过模/数转换卡进入计算机,x 方向表示角度,y 方 向表示反射光强,在屏幕上得到扫描曲线。

当入射角 θ 满足由(3)式表示的匹配条件时, 将激发双面金属包覆介质波导中的模式。实际得到 的扫描曲线如图 7 所示,图中的两个吸收峰表示金 属包覆介质波导中的两个 TE 模。虚线为利用菲涅 耳公式用计算机模拟得到的理论曲线,实线为实验 结果。模拟所用的数据已列于图中,下层金膜的厚 度和衬底的折射率对实验结果没有影响,故未予 列出。



Fig. 6 Experimental setup for measurement



926

Fig.7 Attenuated total reflection curves with $\varepsilon_1 = 2.80$, $d_1 = 2700$ nm, $\varepsilon_2 = -20 + i1.5$, $d_2 = 36$ nm

结论 本文通过理论分析、模拟,提出了一种全新的 耦合方法,并在实验中得到了很好的证实。直接耦 合方法既可免除棱镜耦合带来的不便(如空气隙厚 度的控制和棱镜的加工等),又可省却光栅耦合器的 制备困难,但却兼有棱镜耦合器的优点,即利用直接 耦合可以测量薄膜的折射率和厚度,这种新的耦合 方法预计会有广泛的应用前景。

参考文献

[1] Ulrich R. Theory of prism-film coupler by plane-wave analysis. J. Opt. Soc. Am., 1970, 60(10):1337 ~ 1349

- [2] Tamir T, Peng S T. Analysis and design of grating couplers. Appl. Phys., 1977, 14(3) 235 ~ 253
- [3] Boya J T , Anderson D B. Radiation pattern of an end-fire optical waveguide coupler. Opt. Commun., 1975, 13 (3) 353 ~ 358
- [4] Tien P K, Martin R J. Experiments on light waves in a thin tapered film and a new lightwave coupler. Appl. Phys. Lett., 1971, 18(9) 398 ~ 400
- [5] Jiang Yi, Cao Zhuangqi. Low voltage electro-optical polymer light modulator using attenuated total internal reflection. Opt. and Laser Technol., 2001, 33(9):417 ~ 420
- [6] Jiang Yi, Cao Zhuangqi. Improved attenuated-totalreflection technique for measuring the electro-optic coefficients of nonlinear optical polymers. J. Opt. Soc. Am. (B), 2000, 17(5) 805 ~ 808
- [7] Cao Zhuangqi. Transfer Matrix Method in Guidewave Optics. Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press, 2000. Chap.9
- [8] Chen W P, Chen J M. Use of surface plasma waves fore determination of the thickness and optical constants of thin metallic films. J. Opt. Soc. Am., 1981, 71(2):189 ~ 191
- [9] Schulz L G. The optical constants of silver, gold, copper, and aluminum. I. The absorption coefficient k. J. Opt. Soc. Am., 1954, 44(5) 357 ~ 362
- [10] Schulz L G, Tancherlini F R. The optical constants of silver, gold, copper, and aluminum. []. The index of refraction n. J. Opt. Soc. Am., 1954, 44(5):362 ~ 368

Direct Coupling for Double Metal-Cladding Waveguides

Li Honggen¹⁾ Shen Qishun¹⁾ Cao Zhuangqi¹⁾ Shen Yuquan²⁾ Zhai Jianfeng²⁾

- (1), Department of Physics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240
- (2), Institute of Physics and Chemistry, The Chinese Academy Sciences, Beijing 100101

(Received 13 August 2001; revised 21 September 2001)

Abstract: Based on the dispersion characteristics of double metal-cladding wave guides, a novel coupling method, which is free from using the prism, grating and other coupling elements, is developed. Experimental results agree well with the theoretical prediction.

Key words : direct coupling ; optical waveguides ; dispersion characteristics